

1 視野あたり 30%
20 視野で最大 60%
測定時間短縮!

※ 当社従来機種比

**高性能に“比例”した
圧倒的な使いやすさ**

2017. 8. 6
NEW SEM
DEBUT!!

走査電子顕微鏡

New!

JSM-IT500HR

高輝度電子銃 & ACL レンズ搭載!

光学像から SEM 高倍率測定へ **NonStop!**

3つの新機能で 毎日の分析業務をさらに **早く!** より楽に!

01

光学顕微鏡感覚で視野探し

Zeromag

視野探しの光学 CCD 画像を拡大していくと、自動的に SEM 画像へと切り替わります。視野探しの作業効率が大幅に向上します。

02

観察中も常に元素分析

Live Analysis

観察中も常に元素分析が行われ、GUI 上に観察視野の元素分析結果が常に表示されます。予期しない元素や注目元素を「見つける」「気付ける」確率の向上が期待できます。

03

レポート展開や再解析が快適に

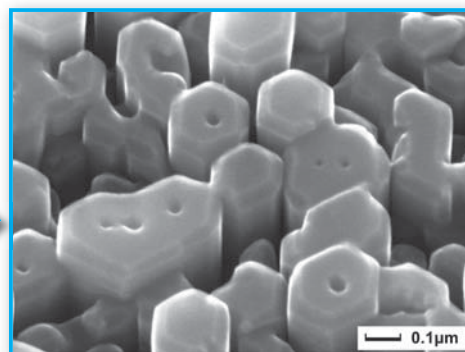
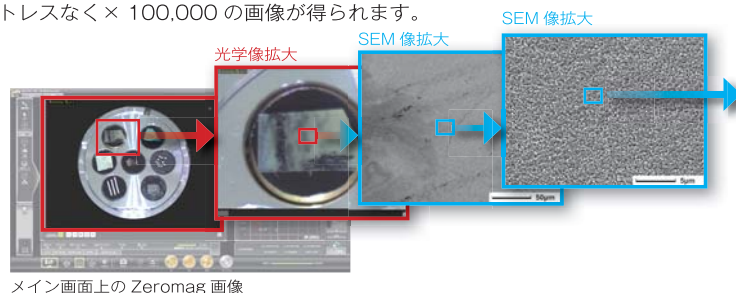
SMILE VIEW™ Lab

視野毎に光学 CCD 像・SEM 像・EDS 分析結果全てのデータを一元管理し、短時間でレポートを作成できるデータマネージャーです。分析中でも取得済みデータを用いて解析が行えます。

Application Data

気付けば × 100,000 の SEM 像

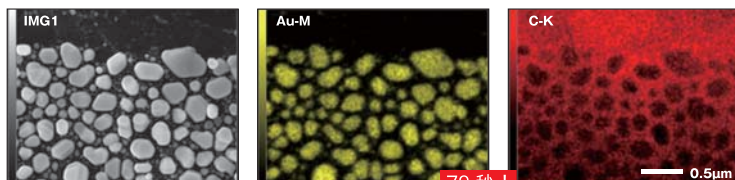
JSM-IT500HR の SEM 像は驚くほど高画質。ライブ像でもストレスなく × 100,000 の画像が得られます。



試料：サファイア基板上に成長させた酸化亜鉛 加速電圧：25 kV
撮影倍率：× 100,000 高真空モード 二次電子像
試料ご提供：東京電機大学 工学部 電子システム工学科 六倉・篠田研究室

高速マッピング&長時間マッピング

大口径 EDS を装着すれば、高速マッピングに対応できます。電流が安定しているため、広領域分析の長時間に及ぶマッピングや全数検査時の終夜運転が必要な時も安心です。



試料：カーボン上の金粒子
加速電圧：20kV、撮影倍率：× 50,000、マップ取得時間：70 秒!

続きは Web で!
JSM-IT500HR を
体感してください。



JEOL 日本電子株式会社

本社昭島製作所

〒196-8558 東京都昭島市武蔵野 3-1-2 TEL: 042-543-1111 (大代表)
www.jeol.co.jp ISO9001・ISO14001 認定取得

本カタログ掲載装置についてのお問い合わせは...

日本電子株式会社 東京事務所 科学・計測機器営業本部

〒100-0004 東京都千代田区大手町 2-1-1 大手町野村ビル 13 階 TEL: 03-6262-3566

またはお客様最寄りの弊社支店までお問い合わせください。

弊社国内支店 → www.jeol.co.jp/corporate/outline/branch.html

このカタログに掲載した商品は、外国為替及び外国貿易法の安全輸出管理の規制品に該当する場合がありますので、輸出するとき、または日本国外に持ち出すときは当社までお問い合わせ下さい。